

产品册

先进的封测解决方案-清洁片

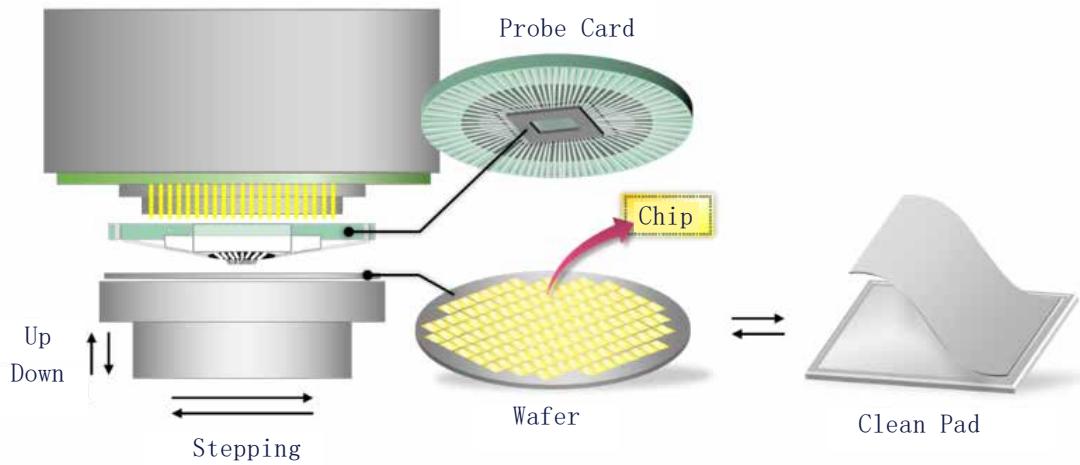


扫一扫，获取更多！

CF-100 清洁片

简介

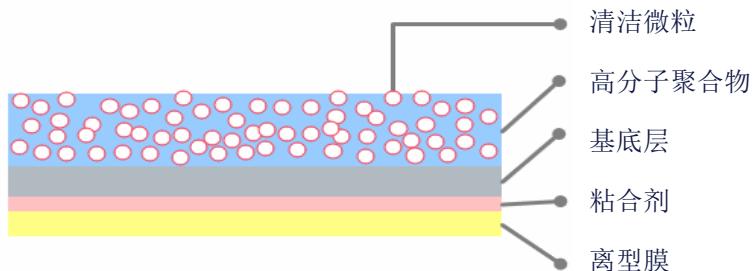
测试探针通常用于晶圆分选和最终封装测试。测试探针充当DUT和测试仪之间的接触接口。探针接触DUT上的焊盘/凸块，形成连接，以进行电气/功能测试。在测试过程中，探针头上会氧化或积聚碎屑。为了尽量减少污物积聚，会采用了离线或在线清洁方法清洁探针头，清洁方法有刷子、化学、激光和清洁片。



特点：

- 有效清洁
- 保护针尖不变形
- 可承受高达150°C的高温

结构

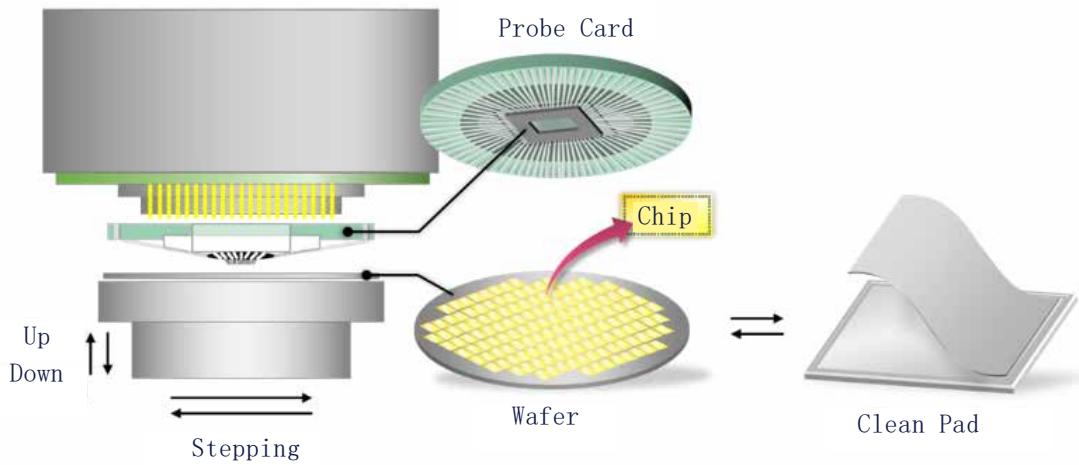


规格	参数
应用类型	Chip Probing (CP)
针尖类型	Crown / Point
清洁微粒大小	1um ~ 3um
厚度	438um ± 20um
磨损 (TD - 20K Cycles)	< 3um
工作温度	-40°C ~ 150°C
清洁模式	Up / Down (垂直)

CF-500 清洁片

简介

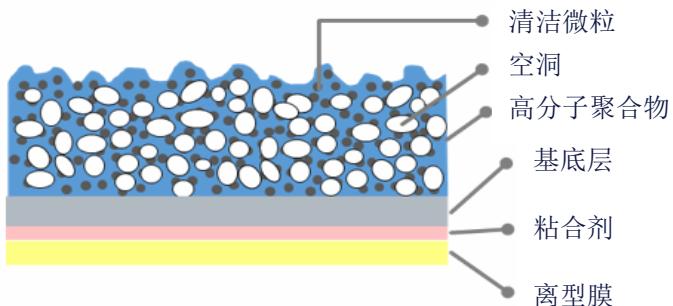
测试探针通常用于晶圆分选和最终封装测试。测试探针充当DUT和测试仪之间的接触接口。探针接触DUT上的焊盘/凸块，形成连接，以进行电气/功能测试。在测试过程中，探针头上会氧化或积聚碎屑。为了尽量减少污物积聚，会采用了离线或在线清洁方法清洁探针头，清洁方法有刷子、化学、激光和清洁片。



特点：

- 有效清洁
- 保护针尖不变形
- 可承受高达130°C的高温

结构

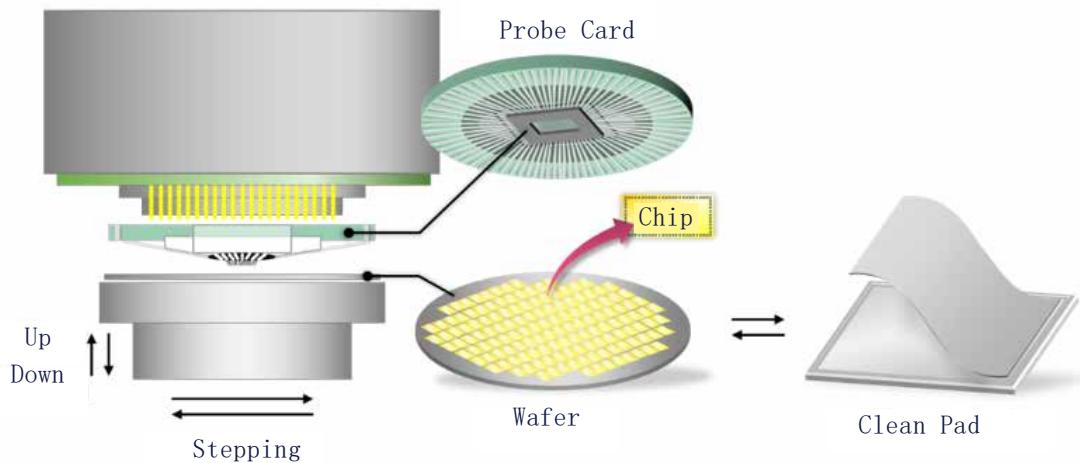


规格	Details
应用类型	Chip Probing (CP)
针尖类型	Crown / Point
清洁微粒大小	2um ~ 4um
厚度	450um ± 20um
磨损 (TD - 20K Cycles)	< 8um
工作温度	-40°C ~ 130°C
清洁方式	Up / Down (垂直)

CF-801 清洁片

简介

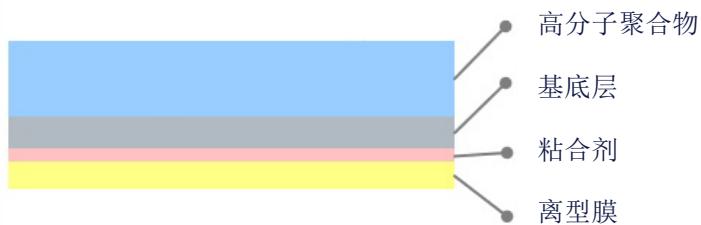
金属探针是探针卡的核心部件，用于电子元件和芯片探测测试台之间的接口。在进行电气测试时，金属探针与芯片焊盘接触。此操作很容易将氧化物或共晶带到焊盘表面，导致金属探针尖端的异物污染。这种污染物会导致电气检测中的误判。CF-801独特的清洁层可以减少磨损，在清洁过程中保护探针尖端形状，延长探针卡的寿命。



特点：

- 有效清洁
- 保护针尖不变形
- 可承受高达200°C的高温
- 提高效率

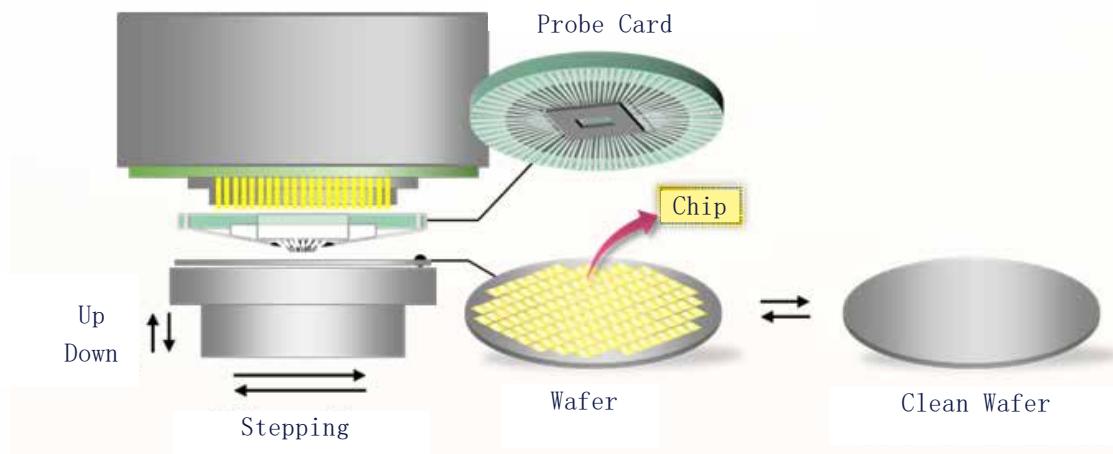
结构



规格	参数
应用针尖类型	Crown / Point
清洁微粒尺寸	0.5um ~ 2um
厚度	375um ± 20um
测试位移值	Full-Contact 30um ~ 80um (Ref.)
工作温度	-40°C ~ 200°C
清洁方式	Up / Down (垂直)

简介

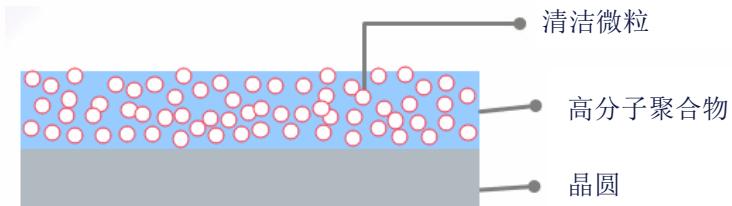
MEMS探针卡具有弯曲特性的金属探针，可处理大型12英寸晶圆。CF-W01清洁晶片用于清除接触面上的碎屑、异物和颗粒，延长探针卡的寿命。



特点：

- 有效清洁
- 保护针尖不变形
- 可承受高达150°C的高温

结构

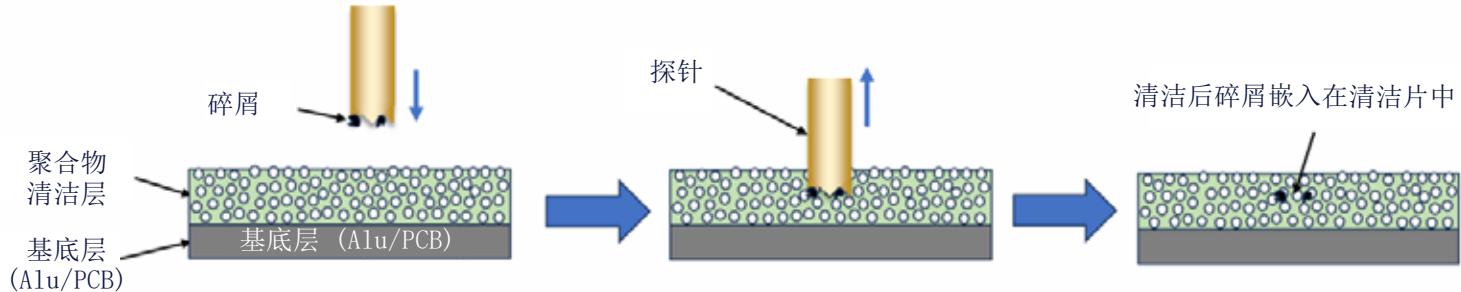


规格	参数
应用类型	Chip Probing (CP)
应用	Memory
应用探针设计类型	MEMS Micro Cantilever
探针尖端类型	Pyramid Tip
清洁微粒大小	1um ~ 3um
晶圆大小	Mounted on 300mm Wafer
厚度	1005um ± 20um
测试位移值	Full-Contact 50um ~ 140um (Ref.)
寿命	> 300
磨损 (TD - 20K Cycles)	< 1um
工作温度	-40°C ~ 150°C
清洁方式	Up / Down (垂直)

CF-900 清洁片

简介

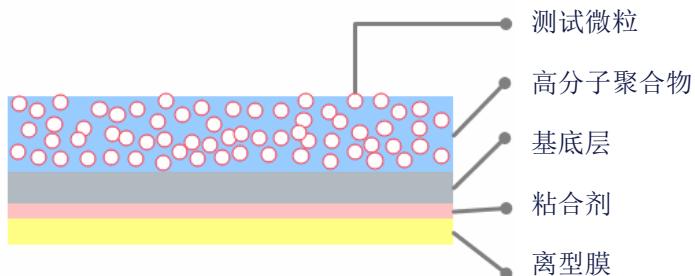
测试探针通常用于晶圆分选和最终封装测试。测试探针充当DUT和测试仪之间的接触接口。探针接触DUT上的焊盘/凸块，形成连接，以进行电气/功能测试。在测试过程中，探针头上会氧化或积聚碎屑。为了尽量减少污物积聚，会采用了离线或在线清洁方法清洁探针头，清洁方法有刷子、化学、激光和清洁片。



特点：

- 有效清洁
- 提高测试良率
- 延长测试机的正常运行时间
- 可承受高达150°C (~300 TD) 的高温

结构

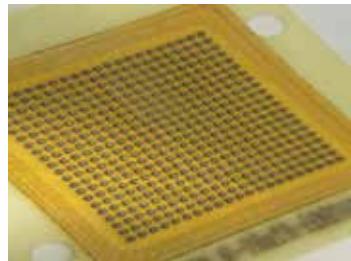


规格	参数
应用类型	Final Test (FT)
应用探针类型	Crown / Point / Kelvin
清洁微粒尺寸	2um ~ 4um
厚度	428um ± 20um
寿命	> 300
磨损 (TD - 300 次)	< 3um
工作温度	-40°C ~ 150°C
清洁方式	Up / Down (垂直)

CF-P85 清洁片

简介

在电子元件的最终测试（FT）中，压敏导电橡胶（PCR）可用作电气测量的接触探针。PCR上存在的杂质可能会影响电子元件的测试结果。CF-P85清洁片用于清除探头触点上的粘附的碎屑，并收集测试过程中产生的异物、颗粒和松散碎屑，以延长测试插座的寿命。



特点

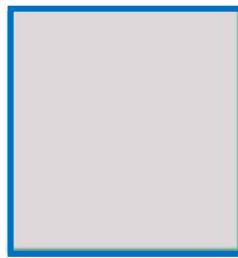
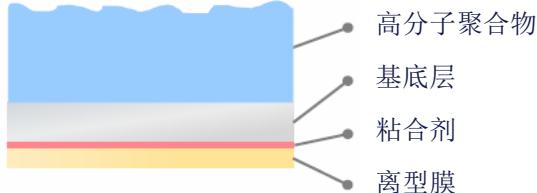
拾取PCR垫上产生的松散碎片

提高首批良率

延长Socket寿命

降低测试成本

结构



清洁前的清洁片



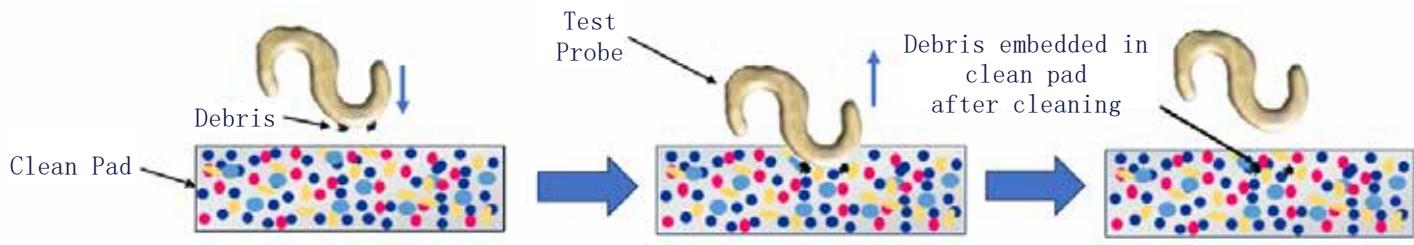
清洁后的清洁片

规格	参数
应用类型	Final Test (FT)
应用探针类型	PCR
厚度	428um ± 20um
寿命	> 300
工作温度	-40°C ~ 130°C
清洁方式	Up / Down (垂直)

CF-R-TYPE 清洁片

简介

在电子元件的最终测试（FT）中，通常采用探针进行电气测量。探针引脚上存在的杂质可能会影响电子元件的测试结果。CF-R型清洁片用于清除滚销上的粘结碎屑，并收集探测过程中产生的异物、颗粒和松散碎屑，以延长测试插座的寿命。



特点：

- 有效清洁
- 提高测试良率
- 延长测试设备正常运行时间
- 耐高温可达180°C

结构



规格	参数
应用类型	Final Test (FT)
应用PIN针型	Rolling Pin
厚度	0.65mm ~ 1mm
工作温度	-40°C ~ 180°C
清洁方式	Up / Down (垂直)

Inspiraz Technology Pte Ltd

Inspiraz Technology 成立于2004年，旨在利用我们员工在各个技术领域的丰富经验，提供最先进的产品和解决方案。

我们的重点领域包括：

- 机器视觉
- 热管理
- 先进的封测方案

 +021 5299 0181

 sales@inspiraz.cn

 上海市静安区天目西路218号嘉里不夜城1座3104室

 <https://www.inspiraz.com>

启毅经销商：

在此处填写您的公司详细信息。

